

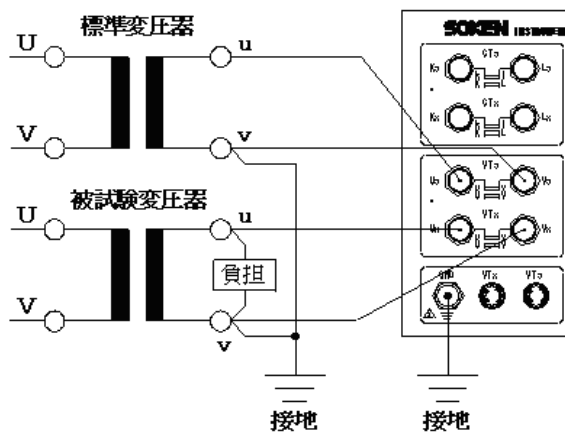
# 計器用変成器誤差試験装置 DAC-VCTT-8 INSTRUMENT TRANSFORMER TEST SET

## 機能説明

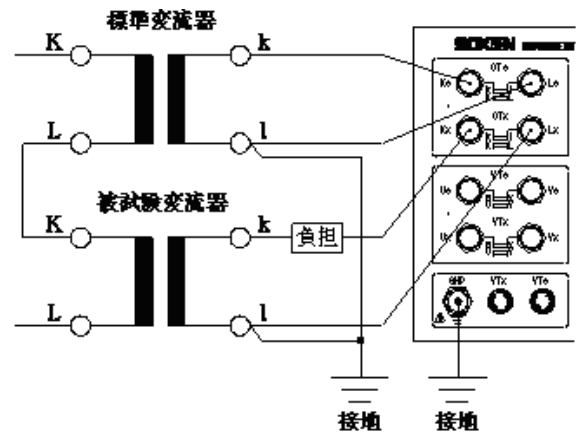
計器用変成器は二次側に接続するインピーダンス(負担)によって誤差が変化します。そのため計器用変成器の試験に際しては、その変成器が実際に使用される時に二次側に接続される計器類の内部インピーダンスと等価なインピーダンスを接続して試験する必要があります。近年、計器用変成器の二次側に接続される計器類は電子化され、それに伴い誤差試験装置自身の内部負担よりも小さい指定負担や零負担の条件で試験しなければならない場合があります。この状況に対応する為、本誤差試験装置DAC-VCTT-8は負担0の設定でも試験できる様に装置自身の自己負担を0にするための補償回路が内蔵されています。弊社の電子式負担装置DAC-PBVC-8と図の様に組み合わせる事によって真の0負担を含めた任意の負担条件で計器用変成器の誤差試験を行う事ができるようになっています。

## 接続図

VT試験



CT試験



## レシオアダプター(オプション) DAC-RAV-2/RAC-2

自動計器用変成器誤差試験装置DAC-VCTT-8のオプションで標準VT/CTと被試験器の変成比が異なる場合でも変成比を等しく変換設定でき、同比試験と同じ様に試験を可能にする装置です。標準器の変更を最小限にする事で試験のスピードアップ及び合理化につながります。



- レシオアダプター設定範囲 (Ks:標準器の変成比 Kx:試料の変成比)
  - VT用 : DAC-RAV-2 Ks/Kx 0.5000~2.0000
  - CT用 : DAC-RAC-2 Ks/Kx 0.5000~2.0000
- 設定方法
  - 同比の場合 例 Ks/Kx=1 設定値1.0000
  - 異比の場合 例 Ks=100 Kx=80
  - Ks/Kx=1.25 設定値1.2500